特集 学生の研究活動報告-国内学会大会・国際会議参加記 36

# IVC-22 に参加して

前田直輝 Naoki MAEDA 電子情報学専攻修士課程 2年

# 1. はじめに

私は、2022年9月11日から16日にかけて、北 海道札幌市の札幌コンベンションセンターにて開催 となった、第22回 INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS に参加し、「Characterization of twodimensional oxide films transferred from liquid metal alloys」という題目で研究発表を行った。

# 2. 研究背景

Ga:O<sub>3</sub>は非層状の Ga 系半導体であり、4.5~4.9 eV の高いバンドギャップから、高い絶縁破壊耐性 を有している為、ハイパワー電子デバイス等への応 用が期待されている.しかし、Ga 族半導体の多く は共有結合を持ち、非層状であるため、原子サイズ の超薄膜の直接的な剥離が課題点である.しかし、 近年 Ga ベース液体金属合金を用いることで、簡易 に高品質且つ極薄の Ga 酸化膜を入手することが可 能であることがわかった.本研究では、Ga ベース 液体金属合金の表面に形成される高品質かつ極薄の 2 次元酸化膜を簡易に入手し、2 次元酸化膜を用い たデバイスへの応用を検討した.

# 3. 実験方法

Ga ベース液体金属合金の表面から2次元酸化膜 を剥離する際の手順を示す.初めに1 cm 角の基板 上(SiO<sub>2</sub>/Si, Au/Ni/SiO<sub>2</sub>/Si)に直径1 mm の Ga ベー ス液体金属合金を着滴した.その後、もう一つの基 板(SiO<sub>2</sub>/Si, Au/Ni/SiO<sub>2</sub>/Si)で Ga ベース液体金属合 金液滴を上から押しだすように潰し、Ga ベース液 体金属合金から基板上に2次元酸化膜を転写した. 次に、沸騰したエタノール(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O)中に2 min 浸 漬し、綿棒を用いて基板に付着した液体金属合金を 除去した後に,超純水に1min 浸漬し,エタノール を除去した.その後,転写された酸化膜上に直径 500 µm の上部電極 Au を成膜した.図1に2次元 酸化膜の転写手順を示す.



#### 4. 実験結果

#### 4.1 基板上に転写した2次元酸化膜の観察

図2に,転写した2次元酸化膜の光学顕微鏡像 (a)及び原子間力顕微鏡像(b),断面プロファイル (c)を示す.光学顕微鏡像より,Gaベース液体金 属合金が100 µm 以上のスケールで転写されている ことを確認.また,転写膜は連続的であることを確 認した.

AFM によって観察した表面形状像及び断面プロ ファイルから,転写された2次元酸化膜の表面粗さ は2nm以下と,高いレベルで均質であることを確 認した.また,断面プロファイルから2次元酸化膜 の膜厚は約3nmとなり,極薄の薄膜であることも 確認した.



図 2 2 次元酸化膜の観察結果 (a) 光学顕微鏡 像, (b) AFM 像, (c) 断面プロファイル

#### 4.2 2次元酸化膜の元素分析

図3(a)2次元酸化膜の走査型電子顕微鏡像 (SEM像)及び図3(b)にエネルギー分散型X線 分析装置(EDS)による2次元酸化膜の定量分析結 果,(c)に透過型顕微鏡(TEM)による断面TEM 像を示す.SEM像において基板と2次元酸化膜の 境界を観測した.また,基板と2次元酸化膜の境界 を観察したところ,基板部分ではGaの検出は確認 されなかったが,2次元酸化膜との境界以降では40 程度と微量ながらGaのスペクトルを検出した.

図3(c)より転写された2次元酸化膜からGa とOの元素スペクトルが検出されたことから、2 次元酸化膜はGaOxであることがわかった.また、 液体金属合金の材料としてIn及びSnを添加して いるがIn及びSnの元素スペクトルが確認されな かった.このことから転写された酸化膜にIn,Sn は含まれていないと考えられる.



図3 (a) 2 次元酸化膜の SEM 像, (b) 2 次元 酸化膜の定量分析結果

### 4.3 超音波装置を用いた金属酸化膜剥離

図4左に30 kHz\_2 h\_50<sup>°</sup> の条件で超音波装置を 用いて液体金属合金 Ga-In-Sn を超純水中に拡散さ せた画像を示す.超音波処理前後で,目に見えて超 純水が懸濁していることが確認でき,Ga-In-Sn が 超純水中に拡散していることがわかる.図4右は SiO<sub>2</sub>/Si 基板上に堆積した Ga-In-Sn 粒子であり,こ れを AFM で観察したところ,径は約200 nm であ り高さは約60 nm であった.



図3(c) 断面 TEM 像及び元素分析結果



図4 左:超音波処理前後のスクリュー管 右: 基板上に堆積した粒子



図 4.2 剥離した粒子の AFM 像

# 5. まとめ

液体金属合金 Ga-In-Sn から2種類の方法を用い て酸化膜を剥離し観察を行った。

#### 謝辞

今回の研究にあたりご指導いただきました山本伸一先 生及び今井崇人先生に心から感謝いたします.